

1. Record Nr.	UNISA996218586703316
Titolo	DBT 2005 : proceedings, 2005 IEEE International Workshop on Current and Defect Based Testing, 2005 : 1 May 2005
Pubbl/distr/stampa	New York : , : IEEE, , 2005
ISBN	1-5386-0065-X
Descrizione fisica	1 online resource (81 pages)
Soggetti	Integrated circuits - Defects Iddq testing Metal oxide semiconductors, Complementary
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia